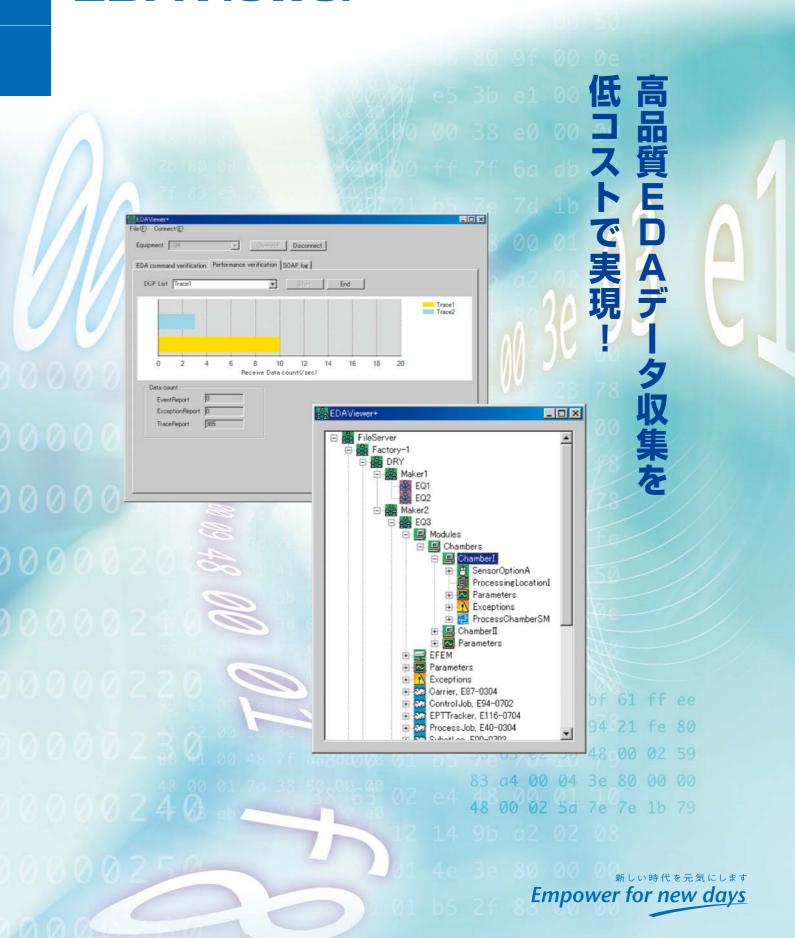


# EDA(Interface A)準拠 装置データ収集パッケージ

イーディーエー・ビューア・プラス

# **EDAViewer+**



# 高品質 EDA (Interface A) データ収集を 低コストで実現!

EDAViewer+ は、EDA (Interface A) 対応装置から、EDA インターフェースを介した 装置詳細データを収集するパッケージソフトウェアです。 EDAViewer+ を起動するだけで高品質な EDA データ収集システムを構築できます。

# 特長・利点

### ● SEMI1105 版に準拠

多くの装置で対応されており、最も実績のある SEMI1 105 版に対応しています。

### ●複数台の装置データを同時に収集可能

同時に複数台の装置に接続し、データ収集を実現します。最小限のハードウェアで EDA データ収集が可能です。

#### ●収集したデータを柔軟に出力可能

収集したデータは DB やファイル等、運用に合わせた出力が可能です。また、装置毎、別々の DB に出力する事も可能です。

#### ● SEMI 規格準拠自動診断機能を標準装備

テスト用コマンドを用いて装置の SEMI 規格準拠状況を自動診断します。装置立ち上げ前のデバッグとして使用する事が可能です。

## ●装置のデータ収集パフォーマンス機能を標準装備

データ収集パフォーマンスを解析し、装置の性能評価を行う事が可能です。

#### ● トラブルシューティングを強力にサポート

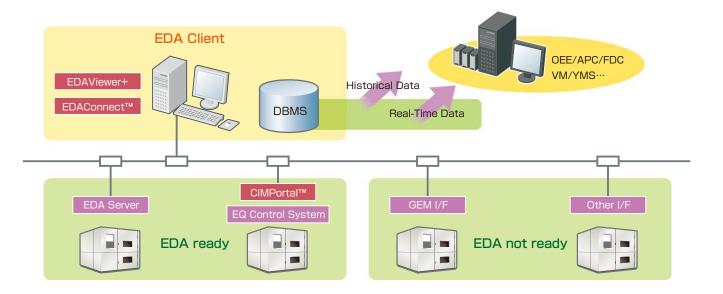
接続異常や装置のメタデータ不正をログに出力し、トラブルシューティングをサポートします。

### 基本機能

- ·SEMI 規格 1105 版対応 (SEMI 規格 0710 版対応予定)
- ・E132 規格 EDA サーバ接続機能
- ・E120 / E125 規格メタデータ取得機能
- · E134 規格 DCP 管理機能

- ・収集データ出力機能
- · SEMI 規格準拠自動診断機能
- ・データ収集パフォーマンス測定機能

## システム構成

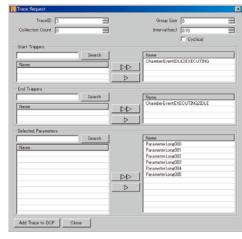


# 使いやすいGUIで必要なデータを必要な時に収集可能!

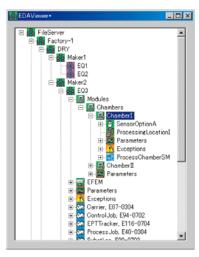
# 操作画面

#### 容易な操作で DCP (Data Collection Plan) を作成して、すぐにデータ収集が可能です。

- ① 装置構成ツリービューを表示(装置から取得した装置構成を元に自動表示)
- ② ツリービューから収集データをドラッグ&ドロップで選択し DCP を登録
- ③ 作成した DCP を用いてデータ収集を開始



[DCP 作成画面]

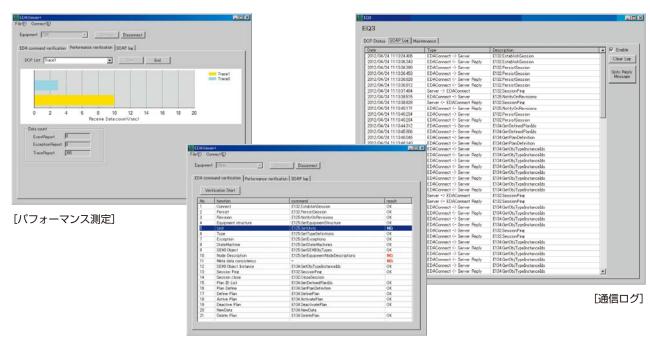


[装置構成ツリービュー]

# 豊富な機能

#### EDA データ収集の基本機能だけでなく、豊富な拡張機能も標準で装備しています。

- ① 対象装置が SEMI 規格に準拠しているかを診断する機能
- ② データ収集のパフォーマンスを測定する機能
- ③ 装置との通信の妥当性を確認できる通信ログ機能



[SEMI 規格準拠診断]

#### 什 様

項目	仕 様
SEMI 規格準拠	E120、E125、E132、E134
基本機能	DCP によるデータ収集、複数装置からの同時収集、データ出力機能
拡張機能	SEMI 規格準拠診断機能、パフォーマンス測定機能
オプション機能	EDA(Interface A)非対応装置のサポート
モニタ、ロギング機能	通信ログ、内部システムログ、異常通知機能(対応予定)

# 動作環境

基本ソフトウェア	32bit	Windows XP Professional SP3 Windows 7 Professional Windows Server 2003 R2	
	64bit	Windows 7 Professional Windows Server 2008 R2	
ミドルウェア	Microsoft .NET Framework 2.0、3.5 SP1		
CPU	Intel Core i3 以上推奨		
メモリ	2GB以上推奨		
ハードディスク空き容量	1GB以上推奨		

# 教育・コンサルティング

当社では、EDA(Interface A)システムの導入を検討されているお客様に対して、ご希望により導入教育を実施いたします。 また、ご要望によりお客様の半導体製造ラインに最適な、EDA(Interface A)システムに関するご提案・コンサルティングを実施いたします。

教育・コンサルティングの詳細については、担当営業までお問合せください。

●SEMI (Semiconductor Equipment and Material International) ●EDA (Equipment Data Acquisition) ●GEM (Generic Equipment Model) ●DCP (Data Collection Plan) ●OEE (Overall Equipment Efficiency) ●APC (Advanced Process Control) ●FDC (Fault Detection and Classification) ●VM (Virtual Metrology) ●YMS (Yield Management System) ●Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Windows XP, Windows 7, Windows Server, 及び.NET は米国Microsoft Corp.の商標又は登録商標です。●EDAConnect 及び CIMPortal は米国Cimetrix社の製品です。●一般に商品名、社名は各社の商標又は登録商標です。ただし本文中に®及びTMマークは記載しておりません。



# 株式会社 明 電 舎 本 社 〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower

# www.meidensha.co.jp



### 安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる 資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■ 仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。

この製品に関するお問合せはコンポーネント事業部

#### ●電子機器営業部

〒141-6029 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower Tel.(03)6420-7610 Fax.(03)5745-3058

